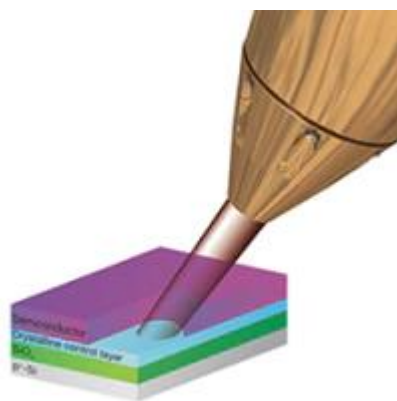
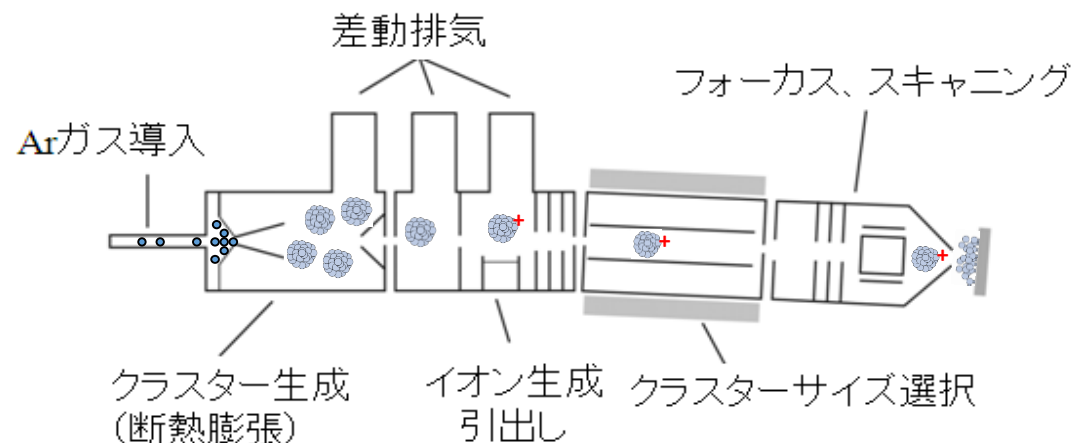


XPS分析事例-6 深さ方向分析(Ag膜)

XPS-NexsaのArビームには単原子モードとクラスターモードがあります。



Arビームは試料の表面を原子レベルでエッチング(削る)際に使用します。積層構造の試料などで特に有効です。



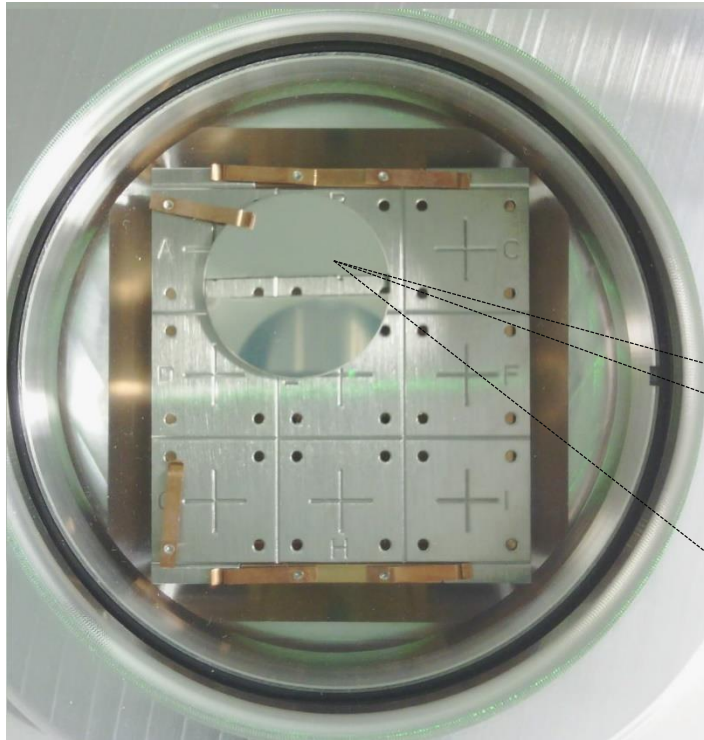
表面エッチングする際のArビームの強度を選択できます。

単Arでは300eV ~ 4000eV

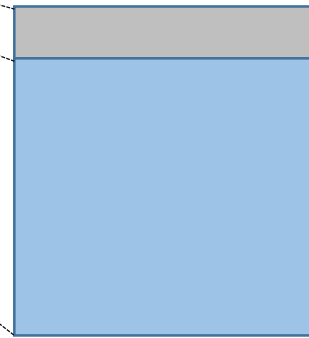
Arクラスターでは, 2000eV ~ 8000eV

(75個 ~ 2000個)

Ag薄膜の深さ方向分析

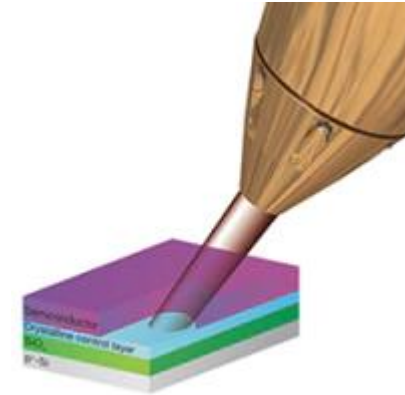


単Arでエッチング



Ag薄膜

Ni下地



表面分析とエッチングを繰り返して行うことにより、原子組成が変化していく様子が分かります

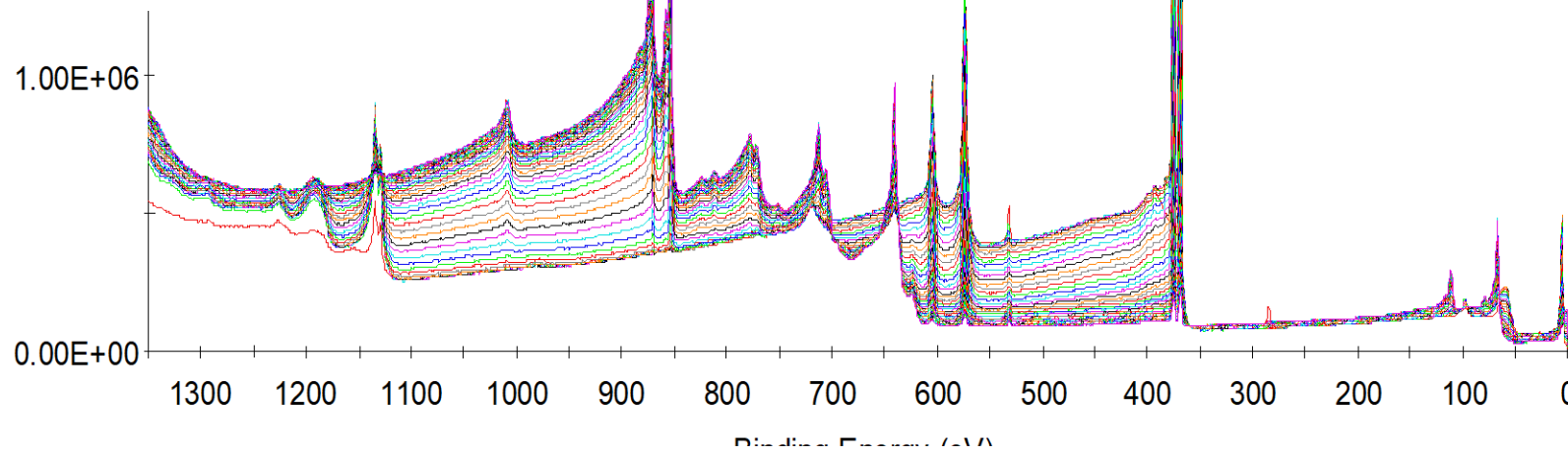
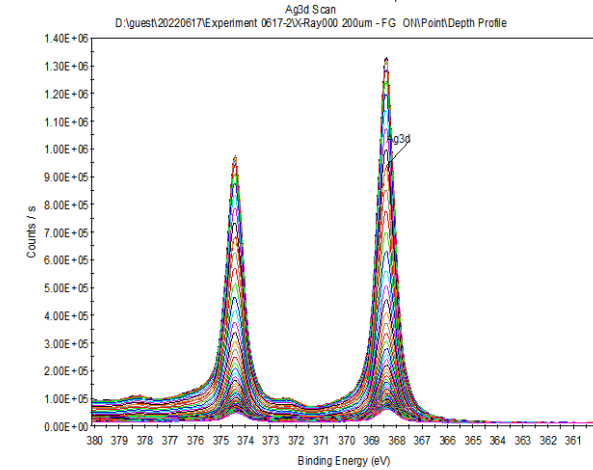
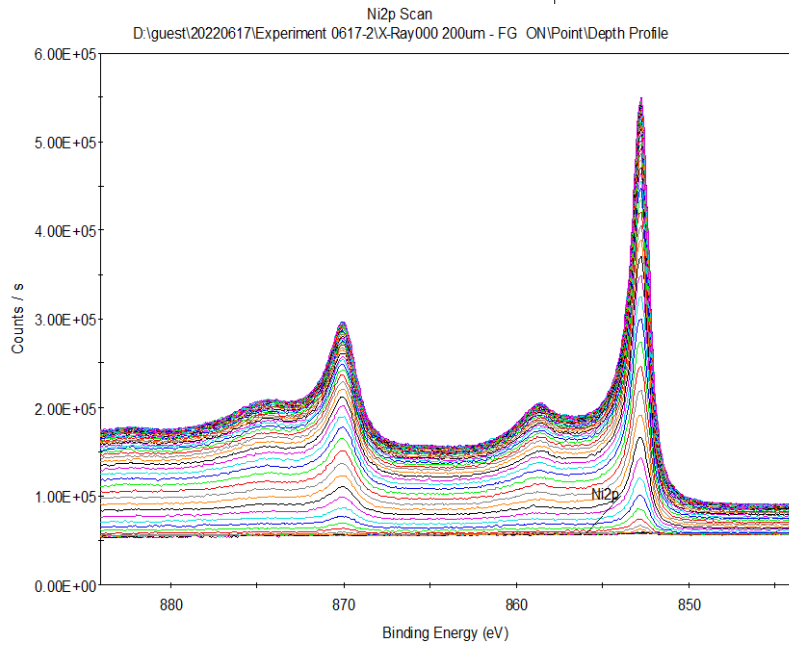
Ag薄膜の深さ方向分析

XPS Survey

\Experiment 0617-2\X-Ray000 200um - FG ON\Point\Depth Profile

Niのピークが増加

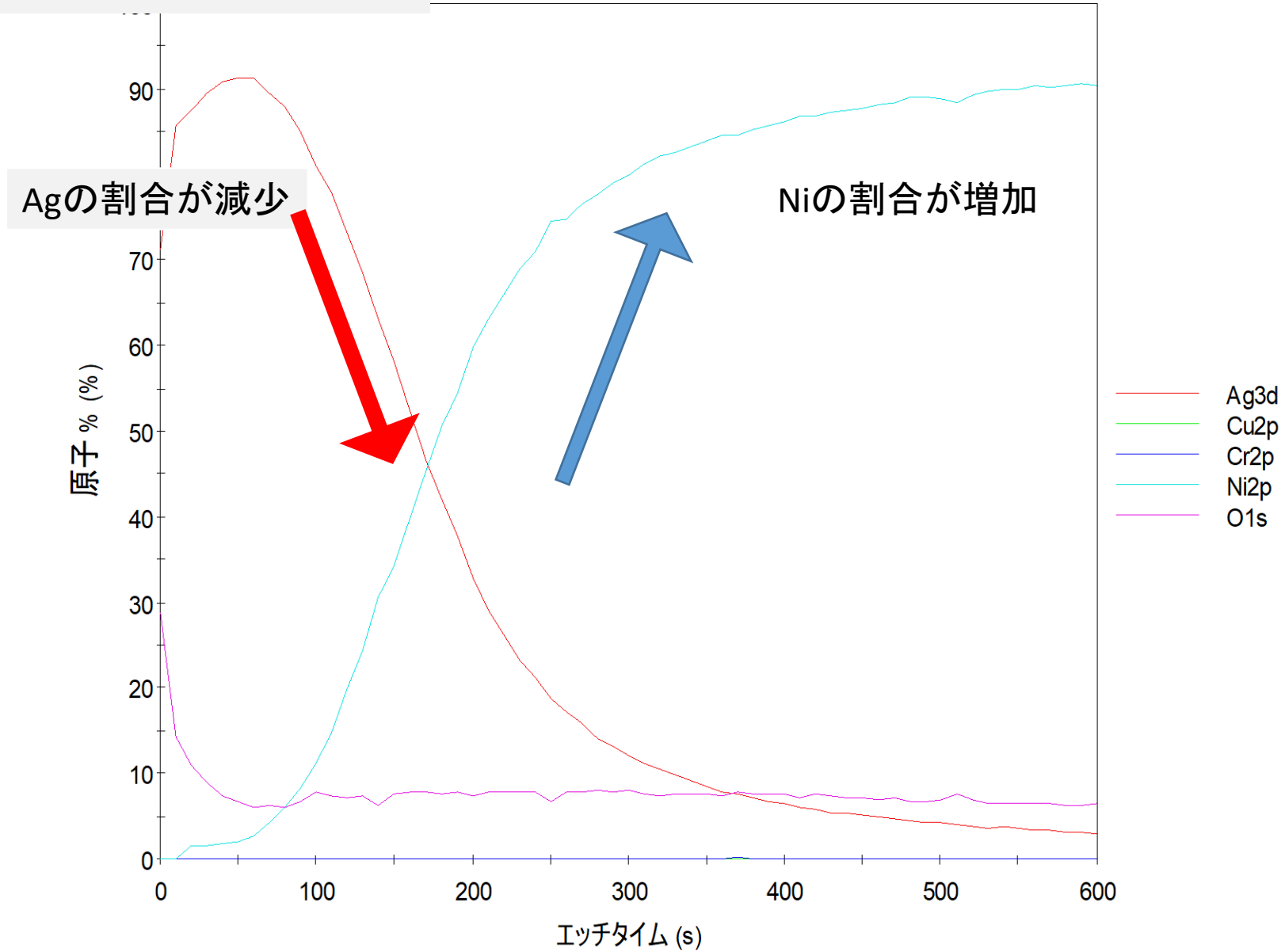
Agのピークが減少



表面分析とエッチングを繰り返して行うことにより、原子組成が変化していく様子が分かります

Ag薄膜の深さ方向分析

Atomic % Profile
rs\engineer\AppData\Local\Temp



表面分析とエッチングを繰り返して行うことにより、原子組成が変化していく様子が分かります